

KWS25A

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	3~4
2. 部品ディレーティング Component Derating	5~7
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	8
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	9
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	10
6. 振動試験 Vibration Test	11
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	12
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	13

* 試験結果は、代表データであります、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。

従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

(1) 部品ストレス解析法MTBF Parts stress reliability projection MTBF

MODEL : KWS25A-24

算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{ss} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{ss} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each part.

*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”
(Document number SR-332, Issue3)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m (N_i \cdot \lambda_{ssi})} \times 10^9 \text{ 時間 (Hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} :全機器故障率(FITs) Total equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} :i番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the ith part

π_{Qi} :i番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the ith part

π_{Si} :i番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the ith part

π_{Ti} :i番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the ith part

m :異なる部品の数 Number of different part types

N_i :i番目の部品の個数 Quantity of ith part type

π_E :機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions

・入力電圧 : 230VAC •出力電圧、電流 : 24VDC, 1.1A (100%)

Input voltage Output voltage & current

・環境ファクタ : GB (Ground, Benign) •取付方法 : 標準取付 A

Environmental factor Mounting method : Standard mounting A

SR-332, Issue3

$$\underline{\text{MTBF(Ta=25°C)}} \doteq 5,747,627 \text{ 時間 (Hours)}$$

$$\underline{\text{MTBF(Ta=40°C)}} \doteq 2,350,202 \text{ 時間 (Hours)}$$

(2) 部品点数法MTBF Part count reliability projection MTBF

MODEL : KWS25A-24

算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数 / 10^6 時間)
 Total Equipment Failure Rate (Failure / 10^6 Hours)

λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数 / 10^6 時間)
 Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure / 10^6 Hours)

n_i : i 番目の同属部品の個数
 Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数
 Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
 Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

MTBF値 MTBF Values

GF : 地上、固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

<u>MTBF</u>	÷	463,762	時間 (Hours)
-------------	---	---------	------------

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : KWS25A-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

取付方法 Mounting method	: 標準取付 : A Standard mounting : A	周囲温度 Ambient temperature	: 45°C
入力電圧 Input voltage	: 100, 200VAC	出力電圧、電流 Output voltage & current	: 5VDC, 5A (100%)

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_j(\max)}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

P_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)損失
(P_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-l} : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

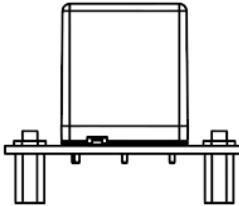
部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = 100%	Ta = 45°C
Q1 TK8Q65W,S1Q TOSHIBA	Tch (max)= 150 °C Pd = 0.79W Tch = Tc + ((θch-c) × Pd) = 104.0 °C D.F. = 69.4 %	θch-c = 1.57 °C/W ΔTc = 57.8 °C Tc = 102.8 °C	
D101 TT208 LITE-ON	Tj (max)= 150 °C Pd = 0.66 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 116.4 °C D.F. = 77.6 %	θj-l = 16 °C/W ΔTl = 60.8 °C Tl = 105.8 °C	
D102 S1JL TSC	Tj (max)= 175 °C Pd = 0.04 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 103.6 °C D.F. = 59.2 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 57.6 °C Tl = 102.6 °C	
D103 ES1DL TSC	Tj (max)= 150 °C Pd = 0.07 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 104.1 °C D.F. = 69.4 %	θj-l = 35 °C/W ΔTl = 56.6 °C Tl = 101.6 °C	
D51 SBR4060CTFP DIODES	Tj (max)= 150 °C Pd = 2.21 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 122.0 °C D.F. = 81.4 %	θj-c = 4.0 °C/W ΔTc = 68.2 °C Tc = 113.2 °C	
A201 TL431RN3 CYS	Tj (max)= 150 °C Pd = 0.001 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 91.2 °C D.F. = 60.8 %	θj-c = 50 °C/W ΔTc = 46.1 °C Tc = 91.1 °C	
PC101 TLP291 TOSHIBA	Tj (max)= 125 °C Pd = 0.83 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 91.3 °C D.F. = 73.0 %	θj-c = 0.25 °C/mW ΔTc = 46.1 °C Tc = 91.1 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC	Load = 100%	Ta = 45°C
Q1 TK8Q65W,S1Q TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pd = 1.03 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pd) = 96.1 °C D.F. = 64.1 %	θch-c = 1.57 °C/W ΔTc = 49.5 °C Tc = 94.5 °C	
D101 TT208 LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.31 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 93.3 °C D.F. = 62.2 %	θj-l = 16 °C/W ΔTl = 43.3 °C Tl = 88.3 °C	
D102 S1JL TSC	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.04 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 93.5 °C D.F. = 53.4 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 47.5 °C Tl = 92.5 °C	
D103 ES1DL TSC	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.07 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 92.0 °C D.F. = 61.3 %	θj-l = 35 °C/W ΔTl = 44.5 °C Tl = 89.5 °C	
D51 SBR4060CTFP DIODES	Tj (max) = 150 °C Pd = 2.13 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 121.4 °C D.F. = 80.9 %	θj-c = 4.0 °C/W ΔTc = 67.9 °C Tc = 112.9 °C	
A201 TL431RN3 CYS	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.001 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 89.9 °C D.F. = 60.0 %	θj-c = 50 °C/W ΔTc = 44.8 °C Tc = 89.8 °C	
PC101 TLP291 TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pd = 0.87 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 87.8 °C D.F. = 70.3 %	θj-c = 0.25 °C/mW ΔTc = 42.6 °C Tc = 87.6 °C	

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : KWS25A-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

		Mounting A	
取付方法 Mounting Method			
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)			
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC	200VAC	
出力電圧 Vout Output Voltage		5VDC	
出力電流 Iout Output Current		100% load	

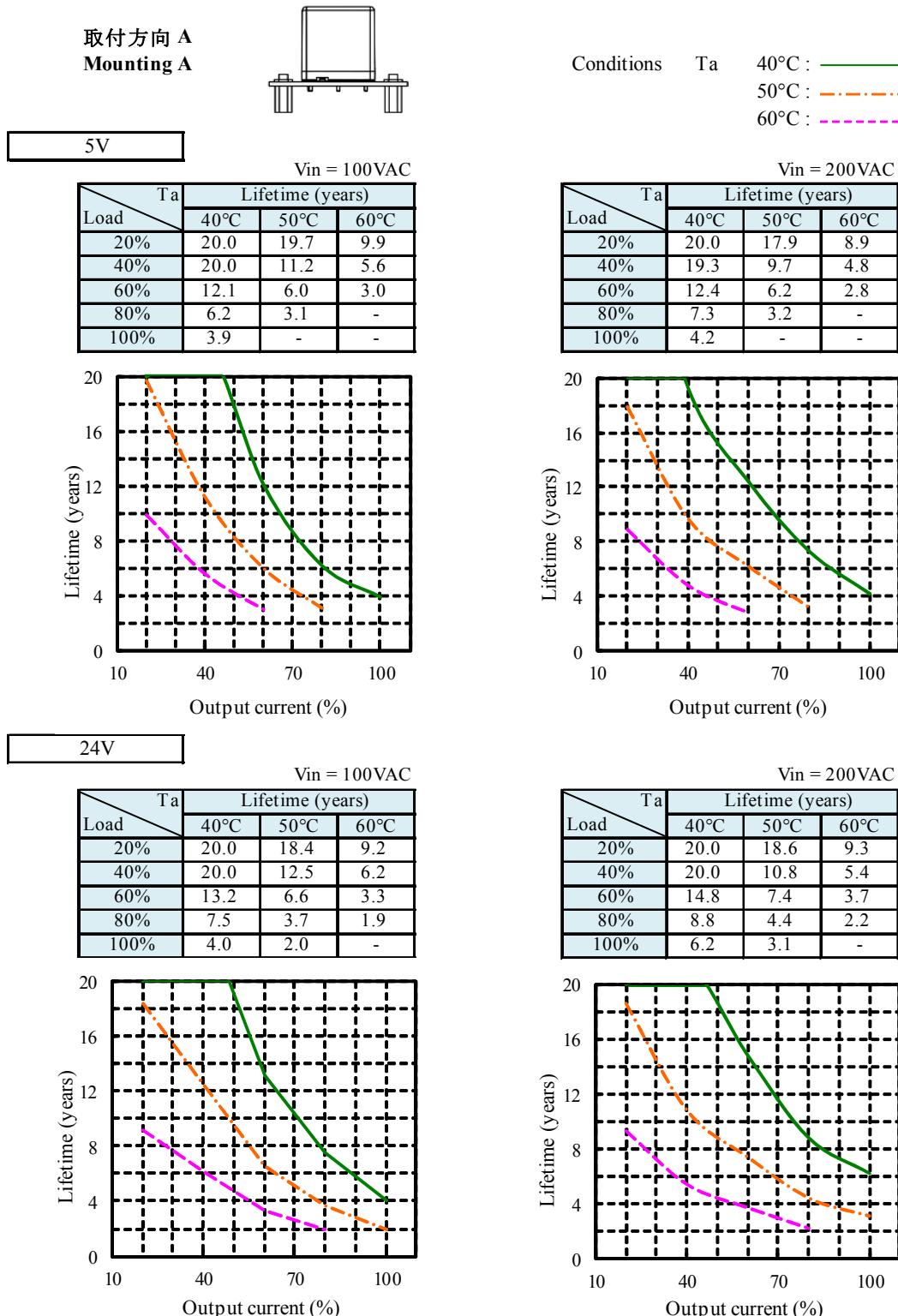
(2) 測定結果 Measuring Results

		ΔT Temperature Rise (°C)	
出力ディレーティング Output Derating		100VAC	200VAC
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=45°C	
		Mounting A	
Q1	MOS FET	57.8	49.5
D101	BRIDGE DIODE	60.8	43.3
D102	DIODE	57.6	47.5
D103	DIODE	56.6	44.5
D51	SBD	68.2	67.9
T1	TRANS	57.6	56.2
L1	CHOKE COIL	49.1	34.4
L51	CHOKE COIL	54.2	53.5
C2	ECAP	46.1	40.3
C208	ECAP	49.6	48.9
A101	CHIP IC	52.8	41.3
A201	SHUNT REGULATOR IC	46.1	44.8
PC101	PHOTO COUPLER	46.1	42.6

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : KWS25A

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : KWS25A-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 265VAC Output : 5V, 100% load Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode	Test result												Note	
	Location No.	Test point		Short	Open	a Fire	b Smoke	c Burst	d Smell	e Red hot	f Damaged	g Fuse blown	h O.V.P.	I O.C.P.	j No output	k No change	l Others
1	C2		○							○	○			○			Da: D101
2				○						○	○			○			Da: A101, Q1
3	C50		○														○ EMI worsen
4				○													○ EMI worsen
5	C208		○											○			
6				○													○ Output ripple increase
7	D101	AC-AC	○									○		○			
8		AC-DC	○							○	○			○			Da: D101
9		DC-DC	○							○	○			○			Da: D101
10		AC	○											○			
11		DC	○											○			
12	D102	A-K	○							○	○			○			Da: Q1
13		A/K	○												○		
14	D51	A-K	○										○	○			Hiccup
15		A/K	○											○			
16	Q1	D-S	○							○	○			○			Da: D101, Z102
17		D-G	○							○	○			○			Da: D101, Z102 , Q1
18		G-S	○											○			
19		D	○											○			
20		S	○											○			
21		G	○							○	○			○			Da: D101
22	A101	1-2	○											○			
23		2-3	○											○			
24		3-4	○											○			
25		5-6	○											○			
26		6-7	○											○			
27		7-8	○											○			
28		1	○											○			
29		2	○										○		○		Hiccup
30		3	○										○				
31		4	○										○				
32		5	○											○	○		Can not restart
33		6	○											○			
34		7	○											○			
35		8	○											○			
36	T1	1-2	○							○	○			○			Da: D101
37		2-3	○							○	○			○			Da: D101
38		3-1	○							○	○			○			Da: D101, Q1
39		4-5	○							○	○			○			Da: D101, Q1
40		FL1-FL2	○											○			
41		1/3	○											○			
42		4/5	○												○		Hiccup
43		FL1/FL2	○											○			
44	L1	1-6	○								○			○			
45		7-12	○								○			○			
46		1/6	○											○			
47		7/12	○											○			

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : KWS25A

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

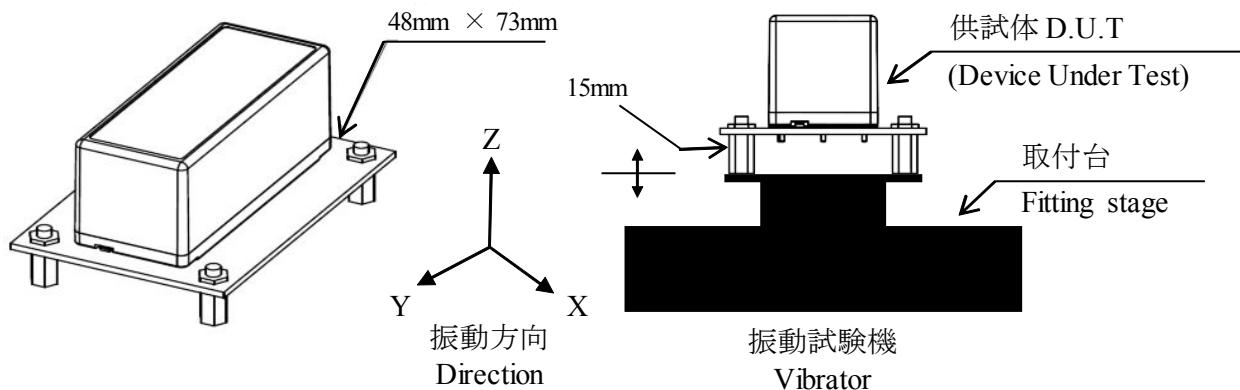
SHINKEN (株) 製 G14-701

SHINKEN CORP.

(3) 試験条件 Test Conditions

周波数範囲	: 10~55Hz	振動方向	: X, Y, Z
Sweep frequency		Direction	
掃引時間	: 1.0分間	試験時間	: 各方向共 1時間
Sweep time	1.0min	Sweep count	1 hour each
振幅	: 一定 1.65mm _{p-p} (Max. 10G)		
Amplitude	Constant		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破損しない事
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.

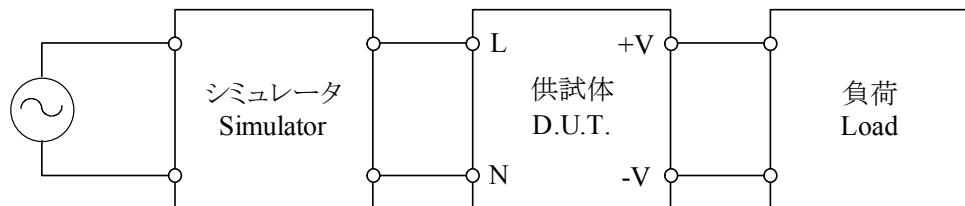
(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : KWS25A

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



Equipment Used (Noise simulator)

ノイズ研究所製 INS-410

Noise Laboratory Co.,LTD

(2) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧	： 100, 230VAC	・ ノイズ電圧	： 0~2kV
Input voltage		Noise level	
・ 出力電圧	： 定格	・ 位相	： 0~360 deg
Output voltage	Rated	Phase	
・ 出力電流	： 0%, 100%	・ 極性	： +, -
Output current		Polarity	
・ 周囲温度	： 25°C	・ 印加モード	： ノーマル
Ambient temperature		Mode	Normal
・ パルス幅	： 50~1000ns	・ トリガ選択	： Line
Pulse width		Trigger select	

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事

The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.

2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事

The output voltage must be within the regulation of specification after the test.

3. 発煙・発火のない事

Smoke and fire are not allowed.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

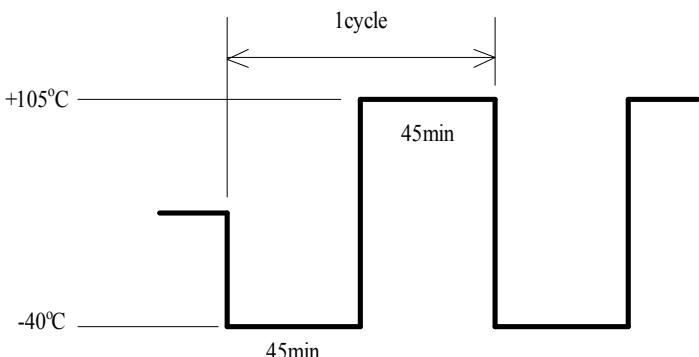
MODEL : KWS25A

(1) 使用冷熱衝撃装置 Equipment Used (Thermal Shock Chamber)

ESPEC 製 TSE-11-A
 ESPEC CORP.

(2) 試験条件 Test Conditions

- 電源周囲温度 : -40°C ⇄ 105°C
 Ambient Temperature
- 試験時間 : 図参照
 Test Time Refer to Dwg.
- 試験サイクル : 276 サイクル
 Test Cycle 276 Cycles
- 非動作
 Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。276サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 276 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事
 No abnormal output after test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK